

半導体デバイスの微細化と発熱問題







P.Gelsinger (Intel CTO): ISSCC 2001

カーボンナノチューブの高い熱伝導率

Berber, Kwon and Tománek, Phys. Rev. Lett. 84, 4613 (2000)



FIG. 2. Temperature dependence of the thermal conductivity λ for a (10, 10) carbon nanotube for temperatures below 400 K.

放熱材料としてのナノチューブ

熱物性値

■ 高い熱伝導率: ~ 2000 W/m・K (300K)

■ 優れた熱的安定性: T_{melt} > 4000K

■機械的に柔軟かつ強靭:

ヤング率 0.9TPa, 比強度は最大150GPa

細くて強い 同じ重さの鉄の 数百倍の強度がある カーボン ナノチューブ線 0.3mm

インテル (2003)



<u> 名大エコ研・楠グループ(2008)</u>



放熱効率15倍向上





<u>考えられ得るいくつかの理由</u>

1) 測定方法の違い: 3ω法, レーザーフラッシュ法など

- 2) 試料の違い: 単層,多層,長さ,直径など
- 3) 純度: 欠陥, 不純物, 構造変形など





欠陥や不純物によるCNT熱伝導への影響

ナノチューブ中の熱流の担い手は?CNT中の熱流の担い手半導体: フォノン
金 属: フォノン+ 重く金 属: フォノン+ 重く● 自由電子に対するヴィーデマン・フランツの法則
$$\left(\frac{\lambda_{el}}{\sigma_{el}T} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e}\right)^2 = 2.45 \times 10^{-8} (V/K)^2$$
● CNTに対するローレンツ比の測定値 $\left(\frac{\lambda_{tot}}{\sigma_{el}T} \sim 10^{-6} (V/K)^2 T=30K \sim 350K$
 $\sigma_{el}T = 10^{-6} (V/K)^2 T=30K \sim 350K$ Hone, et al., PRB 59, R2514 (*99)• フォノン熱伝導 $\left(\frac{\lambda_{ph}}{\lambda_{el}} = \frac{\lambda_{tot}}{\lambda_{el}} - 1 \approx 10^2$

$$\lambda_{\rm tot} = \lambda_{\rm el} + \lambda_{\rm ph}$$



Yamamoto, Watanabe, Watanabe: PRL 96, 255503 (2004)



(10,10)金属カーボンナノチューブの 電子熱伝導度とフォノン熱伝導度の比



3

4



湾曲変形によるCNT熱伝導への影響

) 欠陥や不純物によるCNT熱伝導への影響

熱伝導率と熱コンダクタンスの長さ依存性





Hone *et al.*, Appl. Phys. A **74**, 339 (2002)



Fig.: Thermal conductance of single-walled CNTs with diameter d=1.2nm and d=1.4nm.

低温での熱伝導(バリスティック領域)

Yamamoto, Watanabe, Watanabe: PRL 96, 255503 (2004)



Quantized Thermal Conductance $\kappa_0 = \frac{\pi^2 k_B^2}{3h} T = g_0 T$ $g_0 = 9.4 \times 10^{-13} [W/K^2]$

At Extremely Low T $\kappa_{\rm ph} = 4\kappa_0$



Quantization Plateau Width
 直径が細い→量子化プラトーが広い
 (光学的フォノン励起ギャップ∝1/d)

熱コンダクタンス量子の実験的検証

PRL 95, 226101 (2005)

PHYSICAL REVIEW LETTERS

week ending 25 NOVEMBER 2005

Ballistic Phonon Thermal Transport in Multiwalled Carbon Nanotubes

H.-Y. Chiu,¹ V. V. Deshpande,¹ H. W. Ch. Postma,¹ C. N. Lau,² C. Mikó,³ L. Forró,³ and M. Bockrath^{1,*} ¹Department of Applied Physics, California Institute of Technology, Pasadena, California 91125, USA ²Department of Physics, University of California, Riverside, California 92521, USA ³IPMC/SB, École Folytechnique Fédérale de Lausanne, CH-1015 Lausanne-EPFL, Switzerland (Received 6 July 2005; published 21 November 2005)

We report electrical transport experiments, using the phenomenon of electrical breakdown to perform thermometry, that probe the thermal properties of individual multiwalled carbon nanotubes. Our results show that nanotubes can readily conduct heat by ballistic phonon propagation. We determine the thermal conductance quantum, the ultimate limit to thermal conductance for a single phonon channel, and find good agreement with theoretical calculations. Moreover, our results suggest a breakdown mechanism of thermally activated C-C bond breaking coupled with the electrical stress of carrying $\sim 10^{12}$ A/m². We also demonstrate a current-driven self-heating technique to improve the conductance of nanotube devices dramatically.

熱伝導率と熱コンダクタンスの長さ依存性







d=0.69 nm for (5,5)CNT d=0.41 nm for (3,3)CNT

- S. Maruyama: Physica B **323** (2002) 193.
- S. Maruyama: Nanoscale Microscale Thermophys. Eng. 7 (2003) 41.
- J. Shiomi & S. Maruyama: Jpn. J. Appl. Phys. 47 (2008) 2005.

準バリスティック熱伝導の理論

Ballistic Regime



Landauer formula

$$\kappa(T) = \sum_{\nu} \int_{\omega_{\nu}^{\min}}^{\omega_{\nu}^{\max}} \frac{d\omega}{2\pi} \hbar \omega \left[\frac{\partial f_B(\omega, T)}{\partial T} \right] \times \mathbf{1}$$

Ballistic limit
$$L \ll \Lambda_{\nu}(\omega)$$

Quasi-Ballistic Regime



$$\kappa(T) = \sum_{\nu} \int_{\omega_{\nu}^{\min}}^{\omega_{\nu}^{\max}} \frac{d\omega}{2\pi} \hbar \omega \left[\frac{\partial f_B(\omega, T)}{\partial T} \right] \frac{\Lambda_{\nu}(\omega)}{L + \Lambda_{\nu}(\omega)}$$

Diffusive limit $L \gg \Lambda_{\nu}(\omega)$

Diffusive Regime



Boltzmann–Peierls formula

$$\kappa(T) = \sum_{\nu} \int_{\omega_{\nu}^{\min}}^{\omega_{\nu}^{\max}} \frac{d\omega}{2\pi} \hbar \omega \left[\frac{\partial f_B(\omega, T)}{\partial T} \right] \frac{\Lambda_{\nu}(\omega)}{L}$$

16

カーボンナノチューブへの応用

$$\kappa_{\rm CNT} = \sum_{\nu} \int_{\omega_{\nu}^{\rm min}}^{\omega_{\nu}^{\rm max}} \frac{d\omega}{2\pi} \hbar \omega \left[\frac{\partial f_B(\omega, T)}{\partial T} \right] \frac{\Lambda_{\nu}(\omega)}{L + \Lambda_{\nu}(\omega)}$$

Classical limit

Bose-Einstein distribution \rightarrow Maxwell distribution

$$f_B(\omega,T) = \frac{1}{\exp(\hbar\omega/k_B T) - 1} \approx \frac{k_B T}{\hbar\omega}$$

<u>Empirical expression of MFP</u>

3-phonon U process

$$k_1+k_2=k_3+G$$

 k_2
 k_1
 k_2
 k_3
 k_1
 k_2
 k_3
 k_1
 k_2
 k_3
 k_1
 k_2
 k_3
 k_3
 k_1
 k_2
 k_3
 k_3

Here, $A \approx 2.5 \times 10^{23} \text{ mK/s}^2$ for graphene, *c* is a curvature parameter

$$\kappa_{\rm CNT} = \frac{k_B}{2\pi} \Omega(L) \sum_{\nu} \left\{ \arctan\left(\frac{\omega_{\nu}^{\rm max}}{\Omega(L)}\right) - \arctan\left(\frac{\omega_{\nu}^{\rm min}}{\Omega(L)}\right) \right\}$$

Mean free path $\left[\Lambda_{\nu}(\omega) = \frac{cA}{T\omega^2}\right]$ for Umklapp scattering

Characteristic frequency

$$\Omega(L) \equiv \sqrt{\frac{cA}{TL}}$$
 17

MD計算と新規理論との比較

Yamamoto, Konabe, Shiomi, Maruyama: Appl. Phys. Exp. 2, 095003 (2009)









長さ依存性







3

4



湾曲変形によるCNT熱伝導への影響

) 欠陥や不純物によるCNT熱伝導への影響

湾曲変形効果(MDシミュレーション)



22

湾曲変形効果(実験)





Chang, et al., Phys. Rev. Lett 99, 045901(2007)







ク陥や不純物によるCNT熱伝導への影響

熱伝導率への不純物・欠陥効果(MD計算)



Maruyama *et al.*, J. Therm. Sci. Tech., 1, 138 (2006). Kondo, Yamamoto, Watanabe, e-JSSN 4, 239 (2006)

フォノン散乱シミュレーション

Kondo, Yamamoto, Watanabe: JJAP, 45, L963 (2006)



@ 3.0 meV



@ 11.6 meV









アニーリングによる構造変形

Miyamoto et al., Physica B 323, 78 (2002)

Energy Gain due to Structural Change (DFT calculations)



Energy gain more than 1 eV

アニーリングによる局在フォノンの消失

Yamamoto, Watanabe: Phys. Rev. Lett. 96, 255503 (2006)





まとめ

カーボンナノチューブの熱伝導シミュレーション

1. 熱流の担い手

金属・半導体ナノチューブいずれもフォノンが支配的

2. 長さと半径依存性

細くて長いナノチューブほど熱伝導率が大きい

3. 湾曲変形効果

折り曲げても(6員環構造が壊れない限り)熱伝導率に影響は さほどない。

4. 欠陥•不純物効果

欠陥周辺の局在フォノンが熱抵抗の原因